

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



PTO/SB/21 (08-03)

Approved for use through 08/30/2003. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

		Application Number	10/707,560
		Filing Date	12/22/2003
		First Named Inventor	Yi-Jen Wu
		Art Unit	
		Examiner Name	
Total Number of Pages in This Submission	3	Attorney Docket Number	AUOP0009USA

ENCLOSURES (Check all that apply)

<input checked="" type="checkbox"/> Fee Transmittal Form <input type="checkbox"/> Fee Attached <input type="checkbox"/> Amendment/Reply <input type="checkbox"/> After Final <input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s) <input type="checkbox"/> Extension of Time Request <input type="checkbox"/> Express Abandonment Request <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement <input checked="" type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s) <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/ Incomplete Application <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	<input type="checkbox"/> Drawing(s) <input type="checkbox"/> Licensing-related Papers <input type="checkbox"/> Petition <input type="checkbox"/> Petition to Convert to a Provisional Application <input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation <input type="checkbox"/> Change of Correspondence Address <input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer <input type="checkbox"/> Request for Refund <input type="checkbox"/> CD, Number of CD(s) _____ <input type="checkbox"/> Remarks	<input type="checkbox"/> After Allowance communication to Technology Center (TC) <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences <input type="checkbox"/> Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) <input type="checkbox"/> Proprietary Information <input type="checkbox"/> Status Letter <input type="checkbox"/> Other Enclosure(s) (please identify below):
--	--	--

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT

Firm or Individual name	Winston Hsu, Reg. No.: 41,526
Signature	
Date	12/22/2003

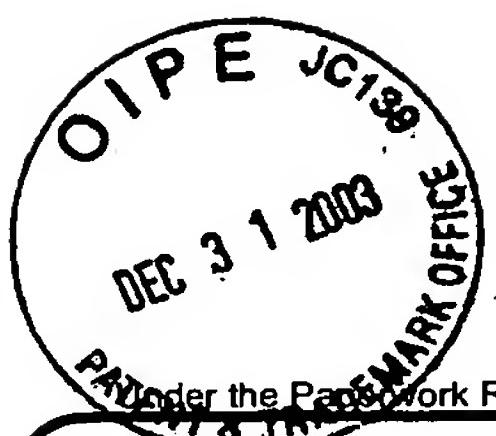
CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING

I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below.

Typed or printed name		
Signature	Date	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



PTO/SB/17 (10-03)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

FEE TRANSMITTAL for FY 2004

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$ 0.00)

Complete if Known

Application Number	10/707,560
Filing Date	12/22/2003
First Named Inventor	Yi-Jen Wu
Examiner Name	
Art Unit	
Attorney Docket No.	AUOP0009USA

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)

Check Credit card Money Order Other None

Deposit Account:

Deposit Account Number	50-0801
Deposit Account Name	North America International Patent Office

The Director is authorized to: (check all that apply)

- Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments
 Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)
 Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.

FEE CALCULATION (continued)

3. ADDITIONAL FEES

Large Entity	Small Entity	Fee Description	Fee Paid
Fee Code (\$)	Fee Code (\$)	Fee Description	
1051 130	2051 65	Surcharge - late filing fee or oath	
1052 50	2052 25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
1053 130	1053 130	Non-English specification	
1812 2,520	1812 2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
1804 920*	1804 920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
1805 1,840*	1805 1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
1251 110	2251 55	Extension for reply within first month	0.00
1252 420	2252 210	Extension for reply within second month	
1253 950	2253 475	Extension for reply within third month	
1254 1,480	2254 740	Extension for reply within fourth month	
1255 2,010	2255 1,005	Extension for reply within fifth month	
1401 330	2401 165	Notice of Appeal	
1402 330	2402 165	Filing a brief in support of an appeal	
1403 290	2403 145	Request for oral hearing	
1451 1,510	1451 1,510	Petition to institute a public use proceeding	
1452 110	2452 55	Petition to revive - unavoidable	
1453 1,330	2453 665	Petition to revive - unintentional	
1501 1,330	2501 665	Utility issue fee (or reissue)	
1502 480	2502 240	Design issue fee	
1503 640	2503 320	Plant issue fee	
1460 130	1460 130	Petitions to the Commissioner	
1807 50	1807 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
1806 180	1806 180	Submission of Information Disclosure Stmt	
8021 40	8021 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1809 770	2809 385	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1810 770	2810 385	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
1801 770	2801 385	Request for Continued Examination (RCE)	
1802 900	1802 900	Request for expedited examination of a design application	

Other fee (specify) _____

*Reduced by Basic Filing Fee Paid

SUBTOTAL (3) (\$ 0.00)

**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above

SUBMITTED BY

(Complete if applicable)

Name (Print/Type)	Winston Hsu	Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350
Signature			Date	12/30/2003	

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



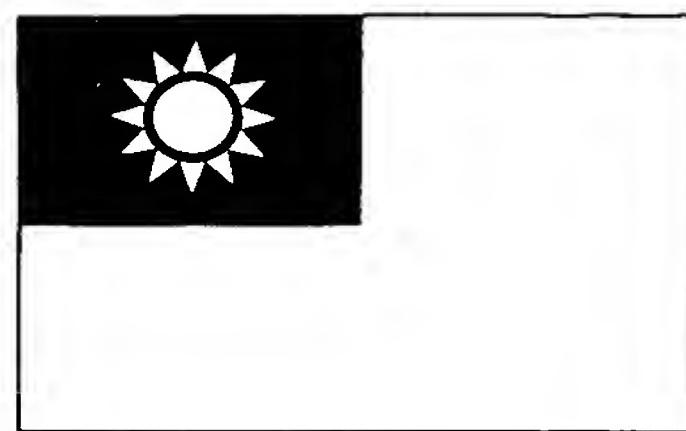
PTO/SB/02B (11-00)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

~~U.S. GOVERNMENT TRADITIONALLY ENCOURAGES THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN THE FEDERAL GOVERNMENT. THIS PAPERWORK REDUCTION ACT OF 1995, NO PERSONS ARE REQUIRED TO RESPOND TO A COLLECTION OF INFORMATION UNLESS IT CONTAINS A VALID OMB CONTROL NUMBER.~~

DECLARATION --- Supplemental Priority Data Sheet

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件，係本局存檔中原申請案的副本，正確無訛，
其申請資料如下：

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日：西元 2003 年 05 月 15 日
Application Date

申 請 案 號：092113211
Application No.

申 請 人：友達光電股份有限公司
Applicant(s)

局 長
Director General

蔡 緣 生

發文日期：西元 2003 年 8 月 15 日
Issue Date

發文字號：09220825930
Serial No.

申請日期：

IPC分類

申請案號：

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書

一、 發明名稱	中文	修補電極圖案缺陷之方法
	英文	A METHOD FOR REPARING ELECTRODE PATTERN DEFECTS
二、 發明人 (共1人)	姓名 (中文)	1. 吳逸人
	姓名 (英文)	1. Wu, Yi-Jen
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (中文)	1. 桃園縣龍潭鄉百年二街三十七之一號十二樓
	住居所 (英文)	1. 12F, No. 37-1, Pai-Nien 2 St. Lung-Tan Hsiang, Tao-Yuan Hsien, Taiwan, R. O. C.
	名稱或 姓名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司
三、 申請人 (共1人)	名稱或 姓名 (英文)	1. AU Optronics Corp.
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (營業所) (中文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英文)	1. No. 1, Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park Hsin-Chu City, Taiwan, R. O. C.
	代表人 (中文)	1. 李焜耀
	代表人 (英文)	1. Lee, Kuen-Yao



四、中文發明摘要 (發明名稱：修補電極圖案缺陷之方法)

本發明提供一種修補電極圖案缺陷之方法。該方法包含進行一檢測程序，以檢測該電漿顯示器上該電極圖案是否有凹陷部分，進行第一修補程序以去除該凹陷部分，而在其中該電極圖案之突出部分，使電極發揮穩定放電功能。

五、(一)、本案代表圖為：第二圖
(二)、本案代表圖之元件符號簡單說明

10	電極圖案	12	透明電極
14	輔助電極	16	凹陷部分
18	導電漿料		

六、英文發明摘要 (發明名稱：A METHOD FOR REPARING ELECTRODE PATTERN DEFECTS)

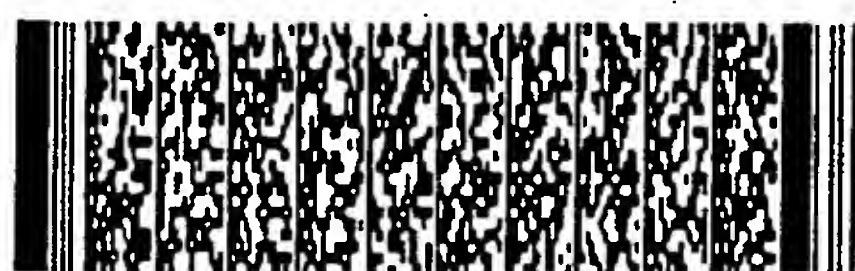
An examining procedure is performed to examine defects of the electrode patterns, then a first repairing procedure is performed to fill the break part, and finally a second repairing procedure is performed to remove the salient part. The first repairing procedure uses a conductive paste to fill the break part of the electrodes, and the second repairing procedure



四、中文發明摘要 (發明名稱：修補電極圖案缺陷之方法)

六、英文發明摘要 (發明名稱：A METHOD FOR REPARING ELECTRODE PATTERN DEFECTS)

uses a laser beam to remove the salient part of the electrode pattern so that the electrodes can discharge constantly.



一、本案已向

國家(地區)申請專利

申請日期

案號

主張專利法第二十四條第一項優先

無

二、主張專利法第二十五條之一第一項優先權：

申請案號：

無

日期：

三、主張本案係符合專利法第二十條第一項第一款但書或第二款但書規定之期間

日期：

四、有關微生物已寄存於國外：

寄存國家：

無

寄存機構：

寄存日期：

寄存號碼：

有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構)：

寄存機構：

無

寄存日期：

寄存號碼：

熟習該項技術者易於獲得，不須寄存。



五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域

本發明係提供一種修補缺陷 (defect) 的方法，尤指一種利用導電性材料與電射光束修補電極圖案缺陷之方法。

先前技術

隨著電子資訊產業的發展，平面顯示器 (flat panel display, FPD) 的應用以及需求不斷擴大，其中電漿顯示器 (plasma display panel, PDP) 由於具有體積小、大尺寸、視角廣等特點，因此已成為平面顯示器中極具發展潛力的產品。

電漿顯示器主要包含有一前基板 (front substrate)，一後基板 (back substrate)，一電離氣體 (未顯示) 填充於前基板與後基板之間用來產生紫外線，以及複數對彼此平行的維持電極 (sustain electrode) 設置於前基板表面，作為放電之用。前基板上另包含有複數條輔助電極 (bus electrode)，分別電性連接於各維持電極上。後基板上則包含有複數個定址電極 (address electrode)，其方向與各維持電極垂直，以及複數個阻隔壁 (rib)，其方向與各定址電極平行，以及一螢光層塗佈於各阻隔壁側壁及各定址電極上。其中，任相鄰之二



元單電漿示，於外分別充當層之螢光元。由其上方相對維持電極關係形成一放電組合，而填充於外之層線，當使組合排列壓，並由數十萬個約數百對離子間隙，使各電極放電而產生紫光。一般單元動電啟動，而各電極放電時，便能作顯示用。

重要，往電電能夠度電銅濺一密易缺放
一放因使啟命期複維氧化先利案很產穩
中常原素的壽以案以如係後圖案痕法
其正的因素的極件，圖。一般極圖刮無
運否放種持致出電複材料一，電極的後
正常是法為維導陳下加電方法面在電上壓
正確對無因為並推提更導作板然下光動
能電電中，過不此製透其前案情或之
器持持程外器也在此的為，於圖的，定
示維維過此示上，案係成極小在預
顯示之而作。顯計壓圖料等成極小在預
電漿元。製成漿設電極材料出來的給
電單線的造電案動電的形電愈存予
電漿元。製成漿設電極材料義愈
電單線的造電案動電的形電愈存予
以上每產電生容在電高維持此極之因
可一生極缺易電極，因此電極
由於離在產會此持提高，維持此極之因
由在電為案高因維持對例，(ITO)或氧化鋅
素得目圖太，低相為(I TO)式暨斷粒造
因使是極壓短降也極錫鍍光度因陷

五、發明說明 (3)

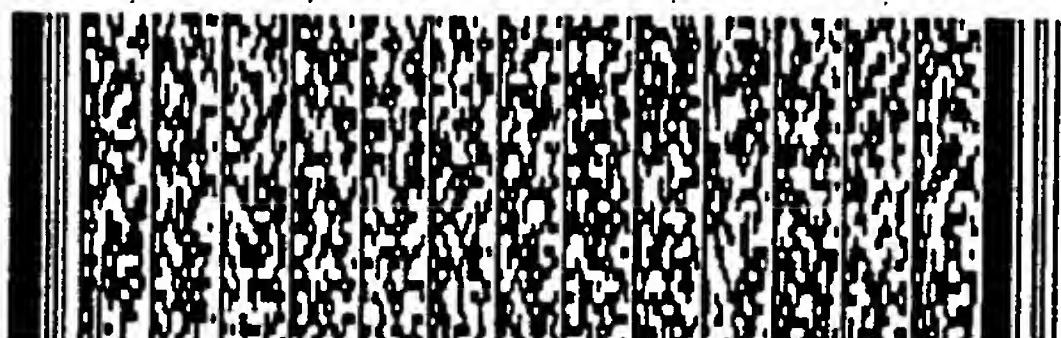
電，或者是造成維持電極在未給予啟動電壓的情形下異常放電的情形。

製往高電極電要不在商提高本升重效果對於廠量因至成提當電放極而解決率漿品對案研避顯質於缺發前方法免示，目陷上導致惡化，然解良電器此圖器相提高的示因極示電顯能決漿能解電產解電顯說，便目前影響的何前標準仍重示，是品的管，嚴顯說，便多電器來，是案寬時鬆使過響示定即陷影顯穩而極用，案嚴電電佳作往成極廢高極課題。

發明內容

因此本發明之主要目的在提供一種修補電漿缺陷所造成電極圖案的方法，以解決上述電極圖案的問題。

該方法極除電補該上填序，以程序，修補第二修補第一檢測一進行以及進行之凹陷部分，具有缺陷之案圖極圖案是案有本。



五、發明說明 (4)

該電極圖案之突出部分。其中在該第一修補程序中，係該利用二該穩定放電功能。揮除該電極圖案之突出部分，使電射光束(laser beam)來發電顯示器之電漿顯示器，係利用一電程序中，來填塞凹陷部分，而該電極圖案之突出部分，則在該第一修補程序中，係該利用二該穩定放電功能。

實施方式

五、發明說明 (5)

步驟 100：開始；
步驟 110：進行一檢測程序，檢測電漿顯示器之電極圖案是否有凹陷；
步驟 120：判斷電極圖案是否有缺陷，若有缺陷則進行修補流程；
步驟 130：進行第一修補程序，以填補電極圖案之突出部分；
步驟 140：進行第二修補程序，以去除電極圖案之凹陷部分；
步驟 150：結束。



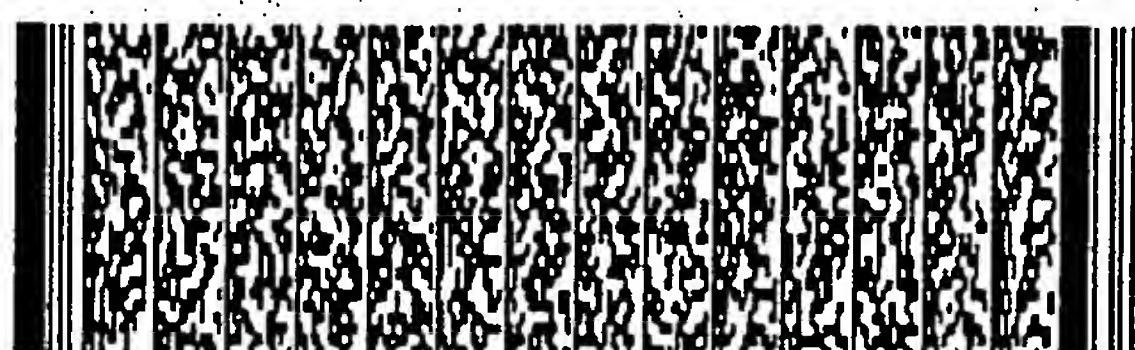
五、發明說明 (6)

常之放電間隙 (discharge gap)，避免電漿顯示器的放電單元產生不正常之放電情形。

五、發明說明 (7)

行檢測程序或是電性檢測程序並檢測出電極圖案10包含有斷線部分17時，本發明即利用一導電漿料18，如上述塗補斷之銀漿料、ITO漿料、IZO漿料、金漿料或銀膠等，來填補斷線部分17，在電極圖案10的斷線部分17，利用導電漿料18來恢復成完整之電極圖案，進而發揮正常導電放電功能。

請參考圖四，圖四為本發明第三實施例修補電極圖。案10為一電漿顯示器之維持電極，包含有一對透明電極12，且透明電極12



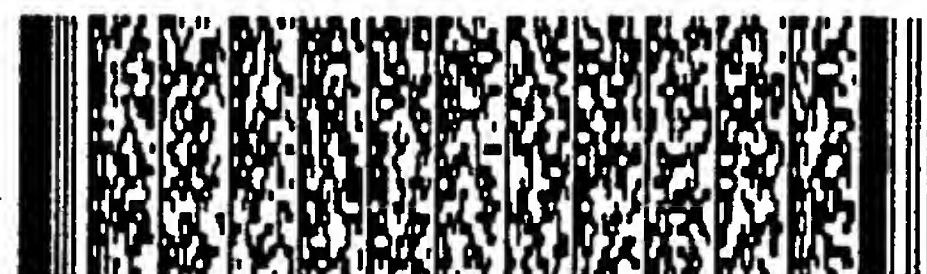
請參考圖五，圖五為本發明第四實施例修補電極圖案30之示意圖。如圖五所示，電極圖案30為一電漿顯示

產案，一檢程修用光上明
易圖貴供以補二利射案發
容極昂提，修第別電圖本
素電本明序一一分一極而極
等使的本測一進亦利補能助
染，器此檢行及。及修功輔能
微粒複顯，行，部，有效電的輔
益漿大進陷分可常顯示
於日電當有缺部突部此正顯示
案設計且相含案陷之陷因此揮漿
案高影，極之圖案分極在極
圖極圖提高案極圖部電用電
電極對成方法電案極圖部電用電
相造成之上極該電突，地應定址
例製案器電除補案陷理以及
示加比於圖示該去填圖缺合以
顯再的對極顯補以料極之亦
電漿填，漿電類亦
電陷產良補電以序電除種方法
生缺陷產修該，程導去「方法
生缺生種測序補一束不之可

五、發明說明 (10)

其他光電顯示器的電極修補製程。

以上所述僅為本發明之較佳實施例，凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾，皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。



圖式之簡單說明

圖。示意圖示之之之之之之之之之之之之之之之之之之之。

圖。示意圖示之之之之之之之之之之之之之之之之之之之之之之之之之之。

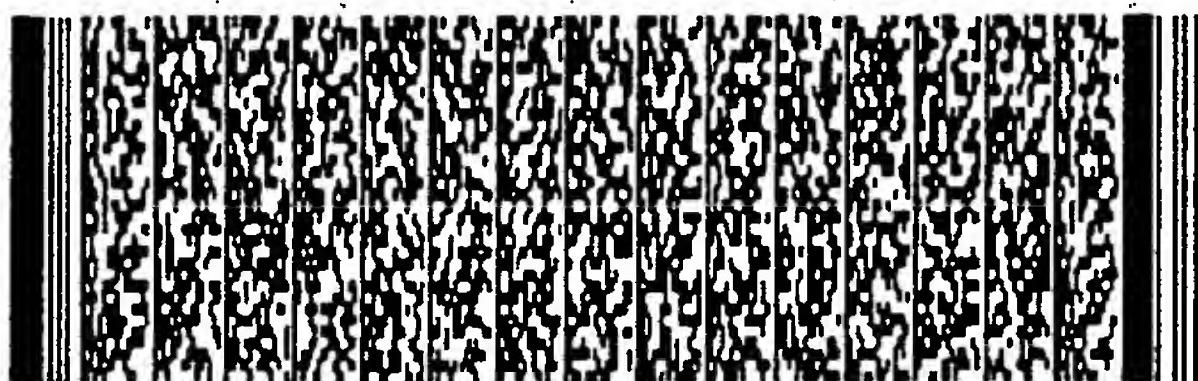
圖式之符號說明

10	電	部	漿	圖	電	極	分	料	案	極	明	透	凹	導	電	輔	開	始	陷	缺	陷
14											16										
17											18										
20											30										
32											34										
36											100										
110												序	是	否	程	程	序	序			
120												測	案	修	修						
130																					
140																					
150																					



六、申請專利範圍

1. 一種缺陷修補 (defect repair) 的方法，係用來修補一基板上之一電極圖案的缺陷，該方法包含有：
 - 進行一檢測程序，以檢測該基板上之該電極圖案是否具有缺陷；以及
 - 進行一第一修補程序，以修補該電極圖案之缺陷。
2. 如申請專利範圍第 1 項之方法，其中該電極圖案係為一電漿顯示器 (plasma display panel, PDP) 之維持電極圖案。
3. 如申請專利範圍第 2 項之方法，其中該維持電極圖案之材料包含有一透明導電材料或一金屬導電材料。
4. 如申請專利範圍第 1 項之方法，其中該電極圖案之缺陷包含有破孔、不完全電連接或斷線等凹陷部分。
5. 如申請專利範圍第 4 項之方法，其中該第一修補程序係利用一導電性材料來填補該凹陷部分。
6. 如申請專利範圍第 5 項之方法，其中該第一修補程序係完整地填補該凹陷部分。
7. 如申請專利範圍第 5 項之方法，其中該第一修補程序係部分地填補該凹陷部分。



六、申請專利範圍

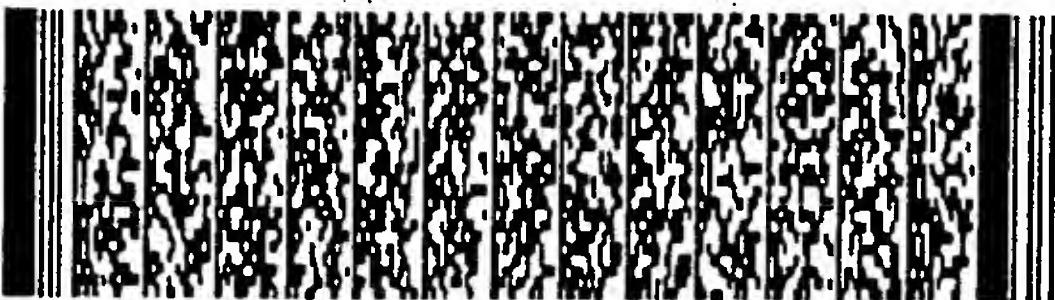
8. 如申請專利範圍第5項之方法，其中該導電性材料係包含有銀漿料(silver paste)、氧化銦錫(indium tin oxide, ITO)漿料、氧化銦鋅(indium zinc oxide, IZO)漿料、金漿料，或銀膠。
9. 如申請專利範圍第1項之方法，其中該電極圖案之缺陷包含有一突出部分。
10. 如申請專利範圍第9項之方法另包含有一第二修補程序，且該第二修補程序係利用一雷射光束(laser beam)去除該突出部分。
11. 如申請專利範圍第1項之方法，其中該檢測程序包含有光學檢測程序或電性檢測程序。
12. 一種缺陷修補的方法，係用來修補一電漿顯示器(plasma display panel, PDP)上之一電極圖案的缺陷，該電極圖案之缺陷包含有一第一缺陷與一第二缺陷，該方法包含有：
 - 一檢測程序，以檢測該電漿顯示器上之該電極圖案之缺陷；
 - 進行一第一修補程序，以填補該第一缺陷；以及
 - 進行一第二修補程序，以去除該第二缺陷。

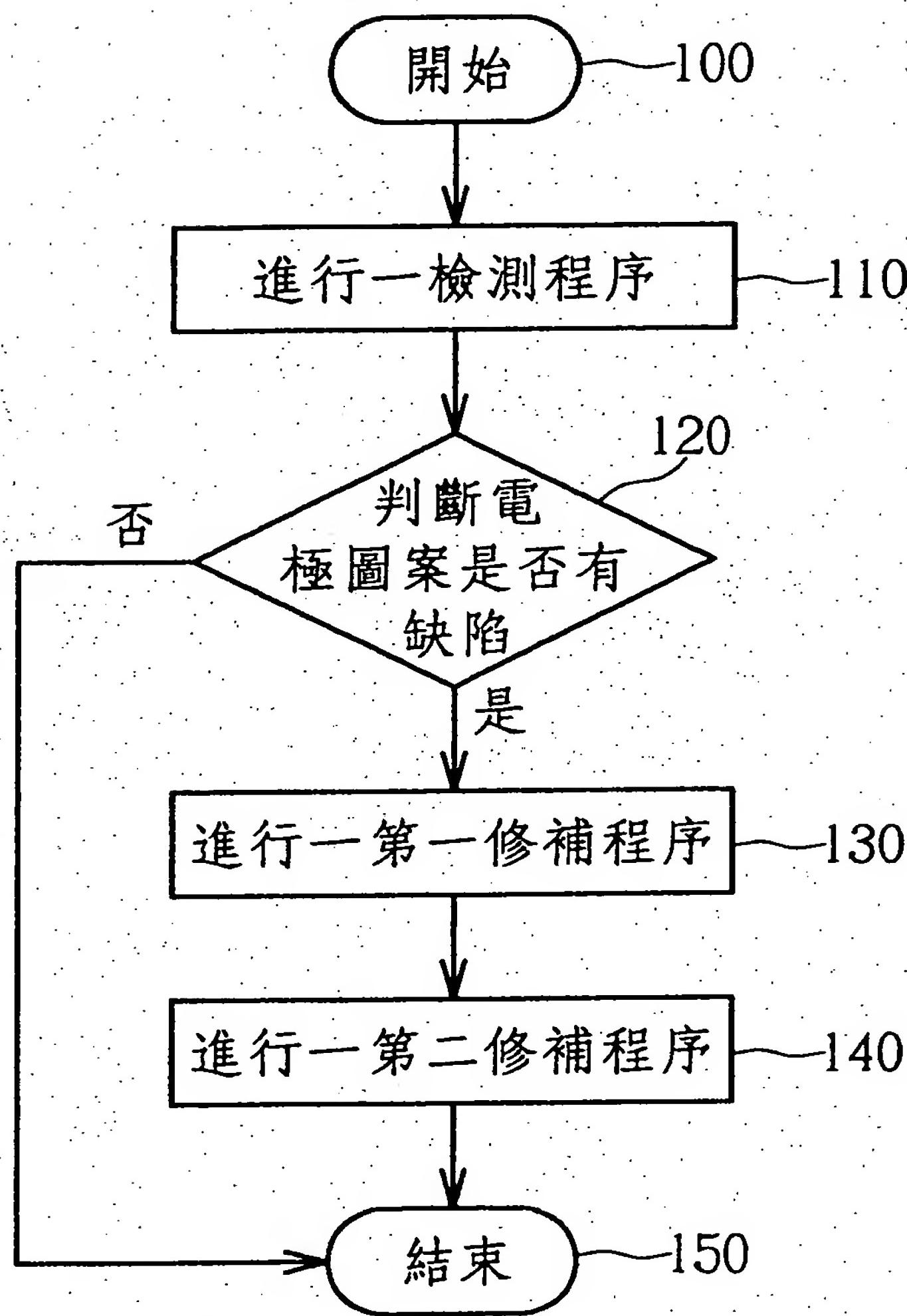
六、申請專利範圍

13. 如申請專利範圍第11項之方法，其中該電極圖案之材料包含有一透明導電材料或一金屬導電材料。
14. 如申請專利範圍第11項之方法，其中該第一缺陷係包含有破孔、不完全電連接或斷線等凹陷部分。
15. 如申請專利範圍第13項之方法，其中該第一修補程序係利用一導電性材料來填補該電極圖案之該凹陷部分。
16. 如申請專利範圍第14項之方法，其中導電性材料係包含有銀漿料(silver paste)、氧化銦錫(indium tin oxide, ITO)漿料、氧化銦鋅(indium zinc oxide, IZO)漿料、金漿料，或銀膠。
17. 如申請專利範圍第14項之方法，其中該第一修補程序係利用該導電性材料完整地填補該凹陷部分。
18. 如申請專利範圍第14項之方法，其中該第一修補程序係利用該導電性材料部分地填補該凹陷部分。
19. 如申請專利範圍第11項之方法，其中該第二缺陷係為該電極圖案之一突出部分。

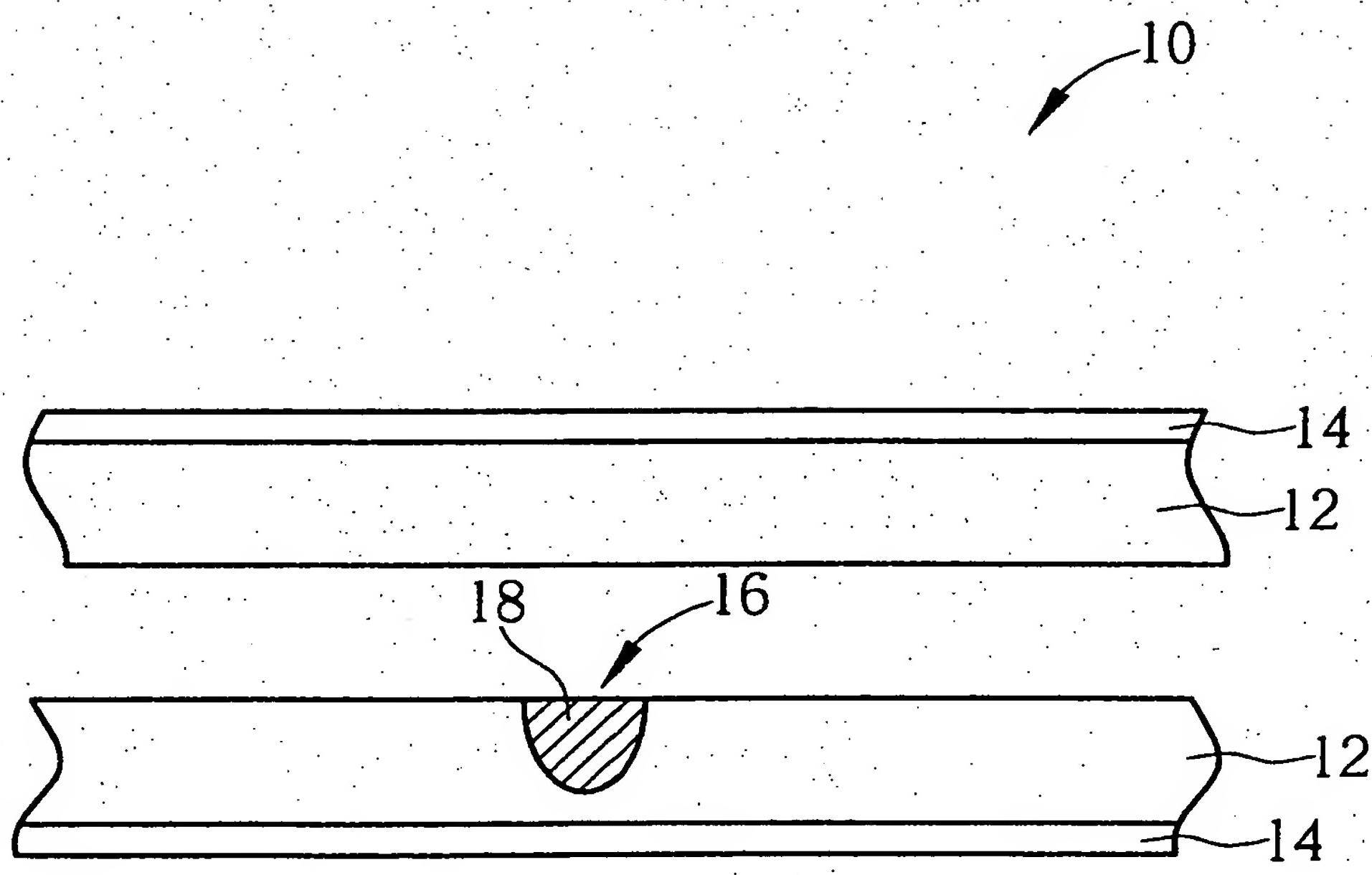
六、申請專利範圍

20. 如申請專利範圍第18項之方法，其中該第二修補程序係利用一電射光束(laser beam)去除該突出部分。
21. 如申請專利範圍第18項之方法，其中該檢測程序包含有光學檢測程序或電性檢測程序，且該電極圖案包含有維持電極(sustain electrode)、輔助電極(bus electrode)以及定址電極(address electrode)。

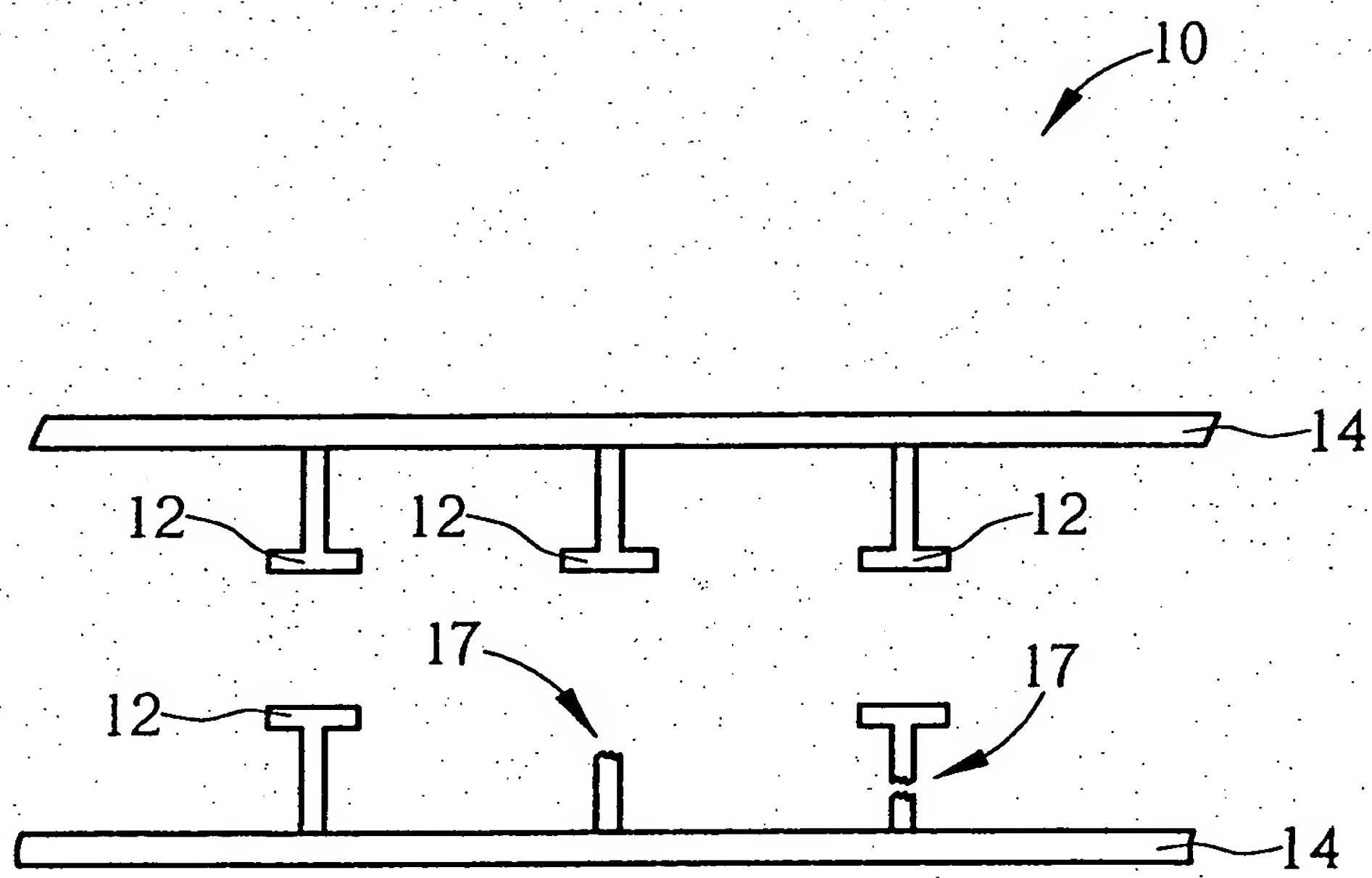




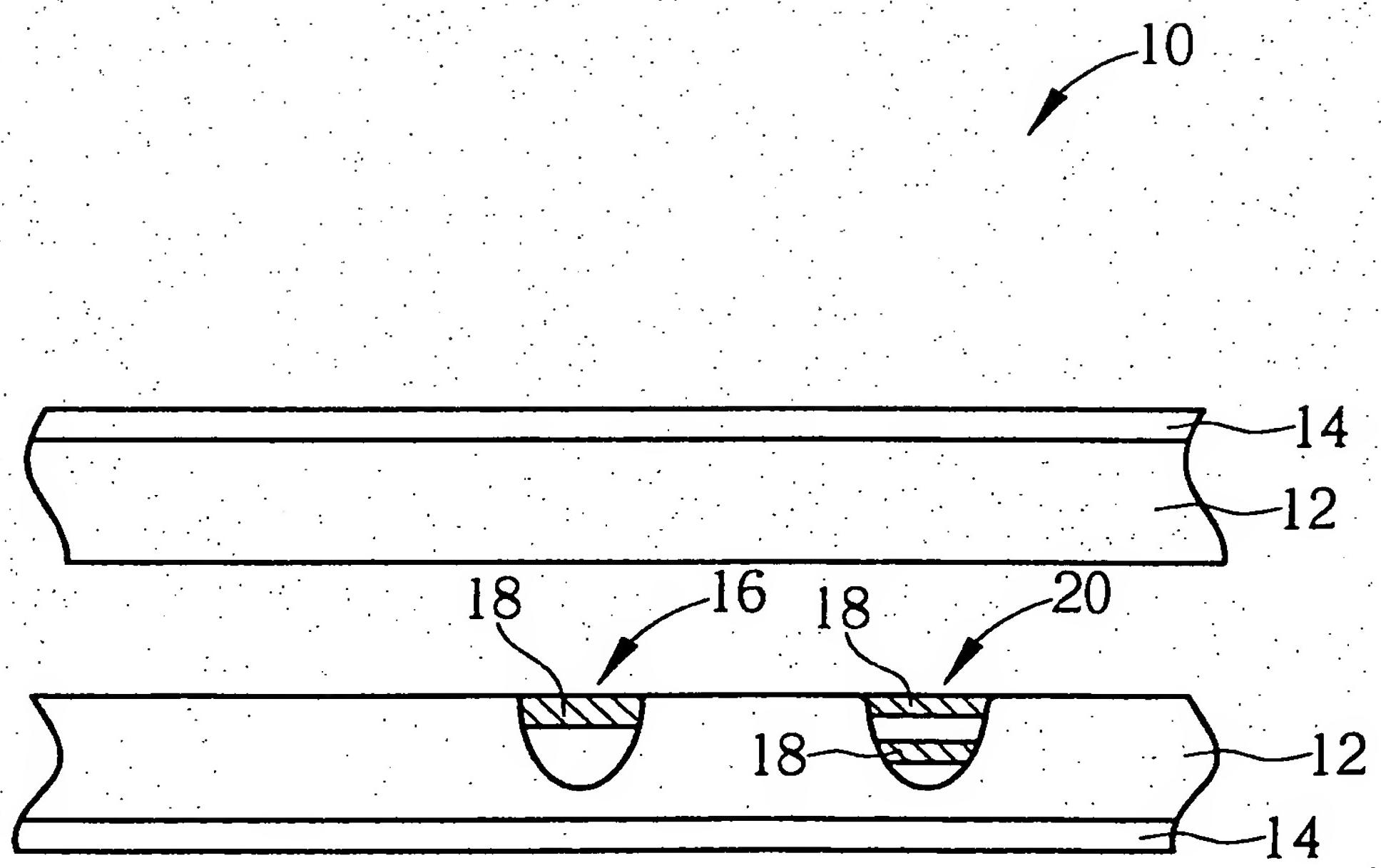
圖一



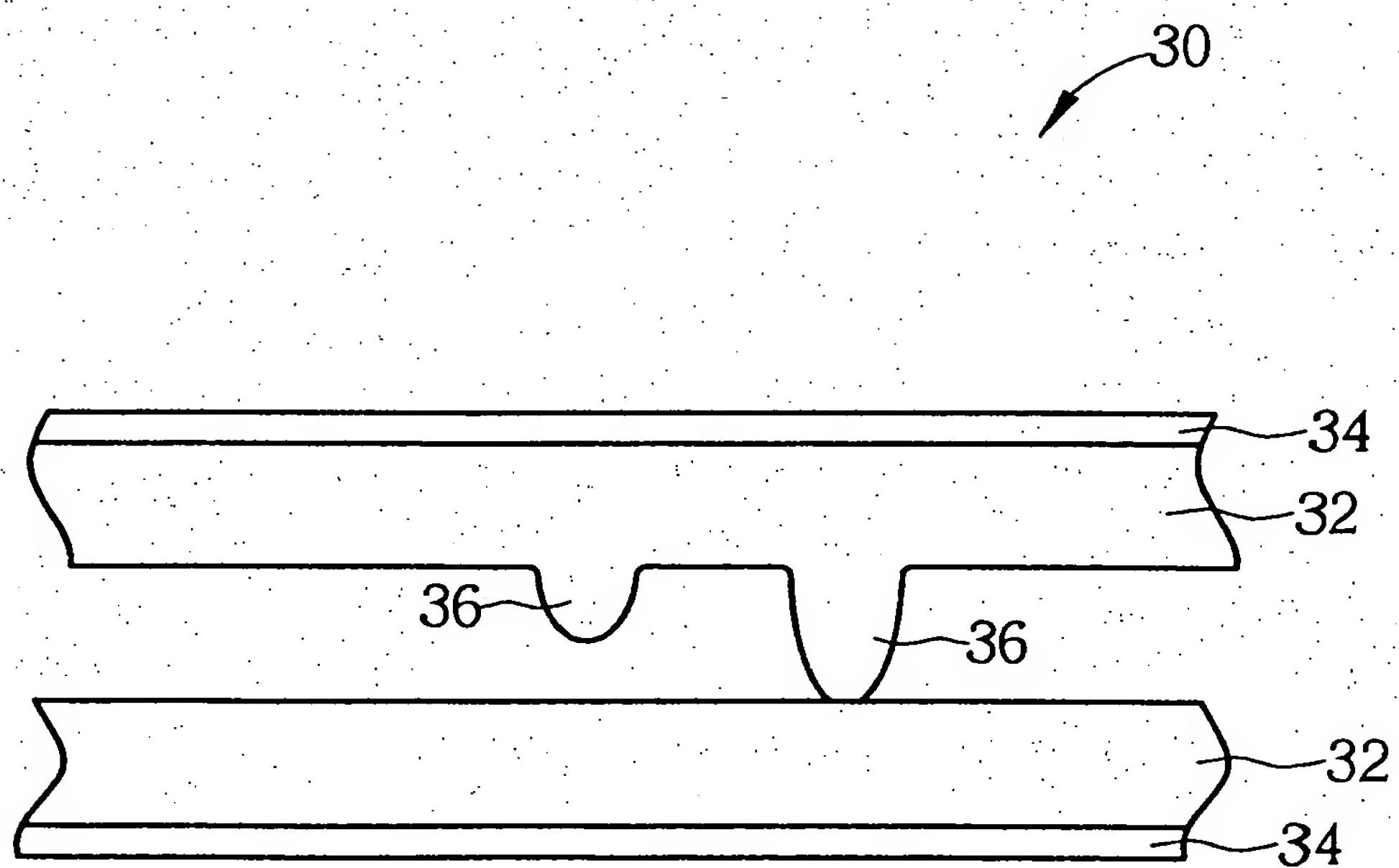
圖二



圖三

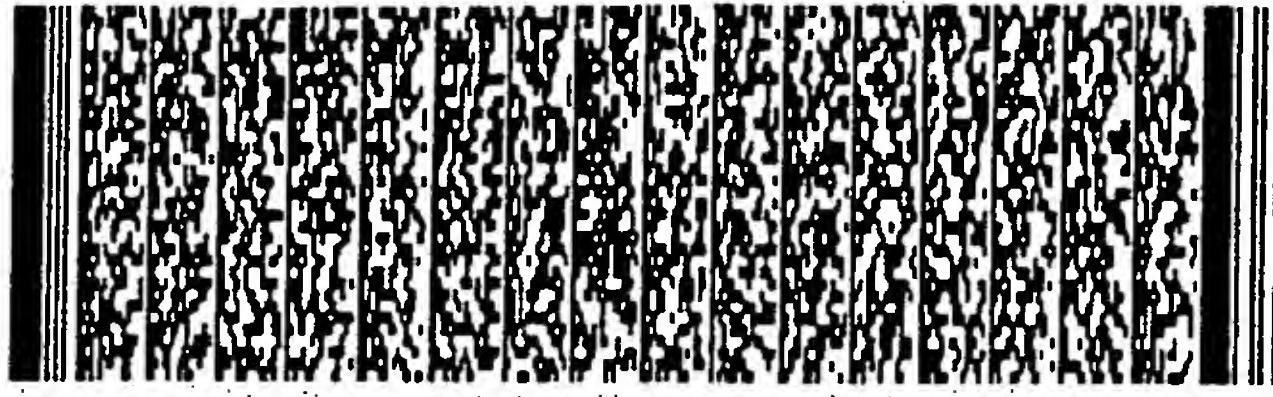


圖四



圖五

第 1/19 頁



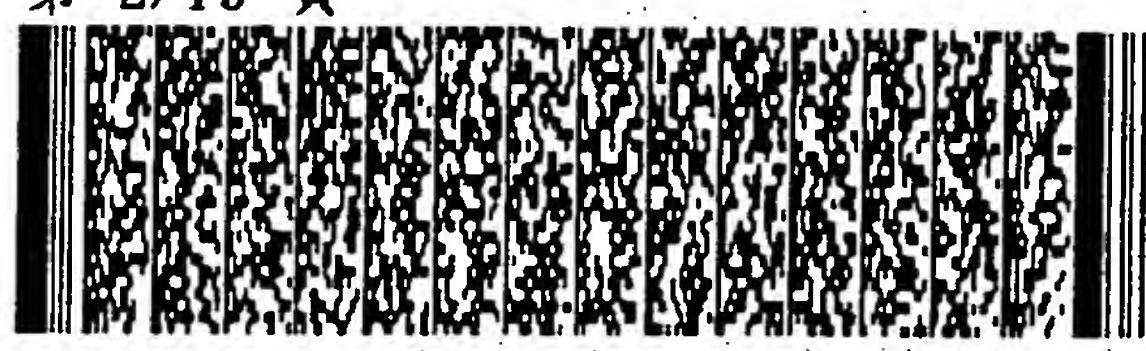
第 2/19 頁



第 3/19 頁



第 2/19 頁



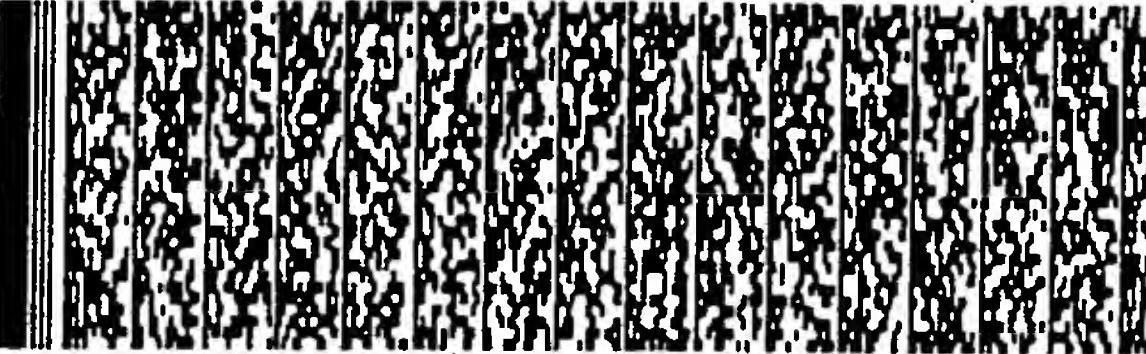
第 3/19 頁



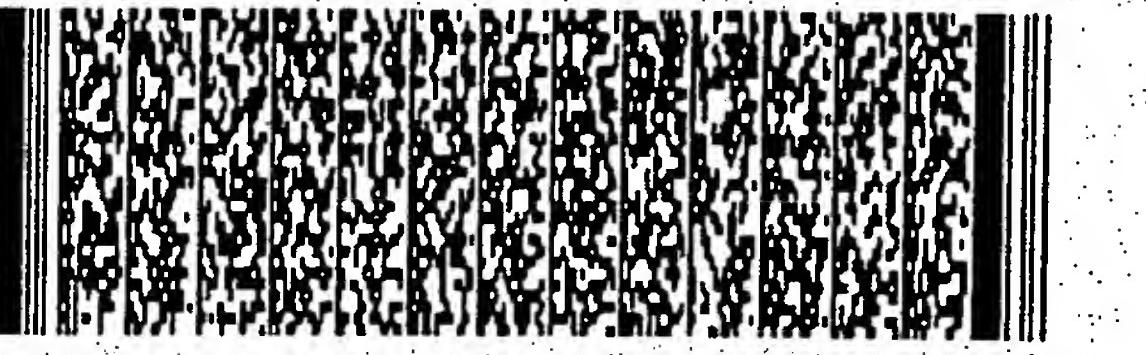
第 4/19 頁



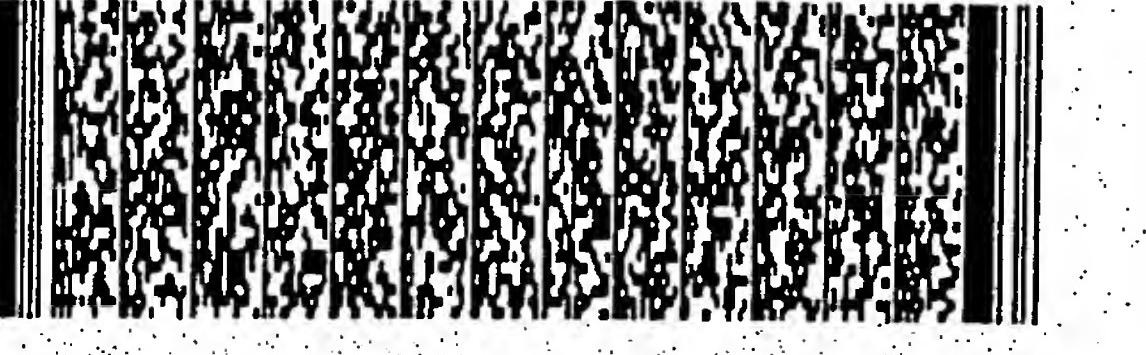
第 5/19 頁



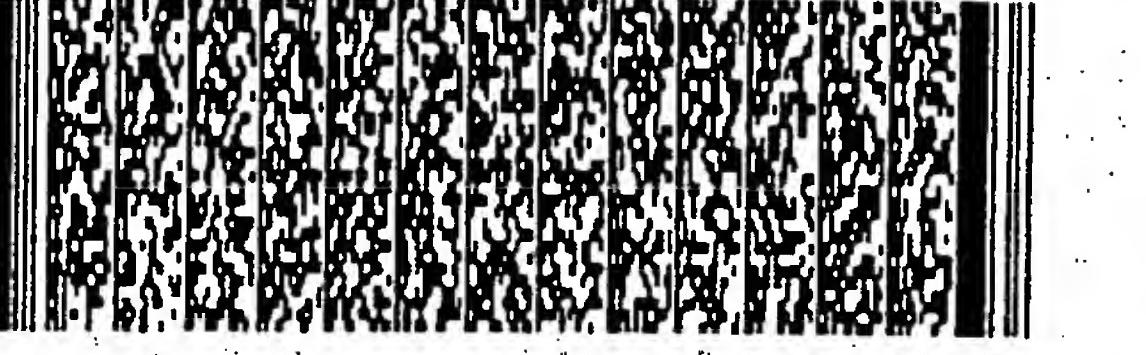
第 6/19 頁



第 7/19 頁



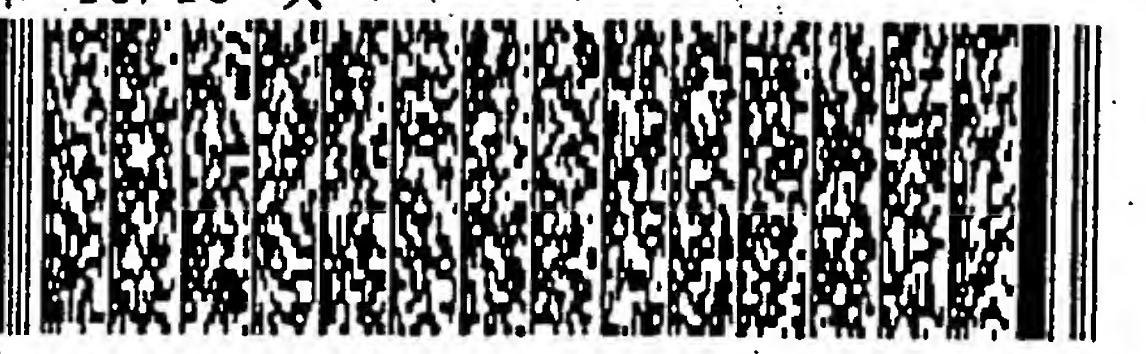
第 8/19 頁



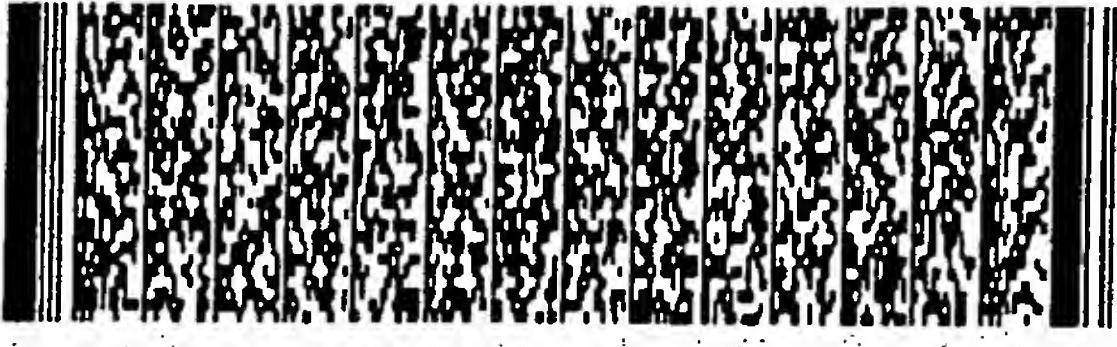
第 9/19 頁



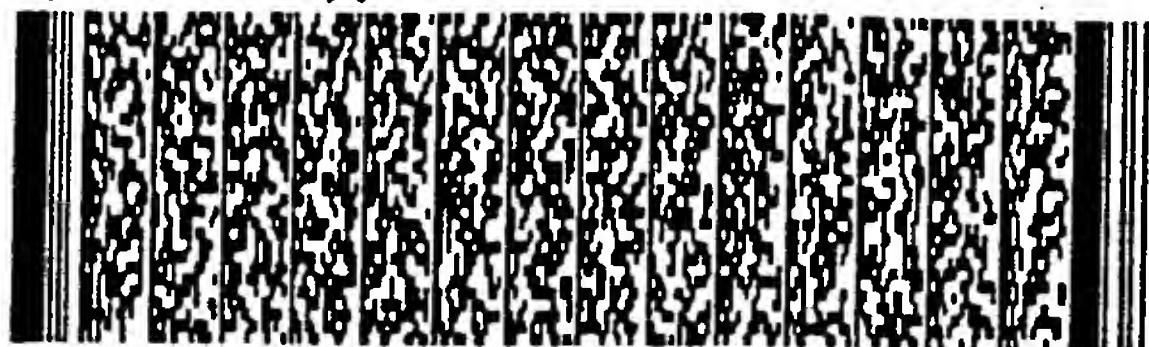
第 10/19 頁



第 10/19 頁



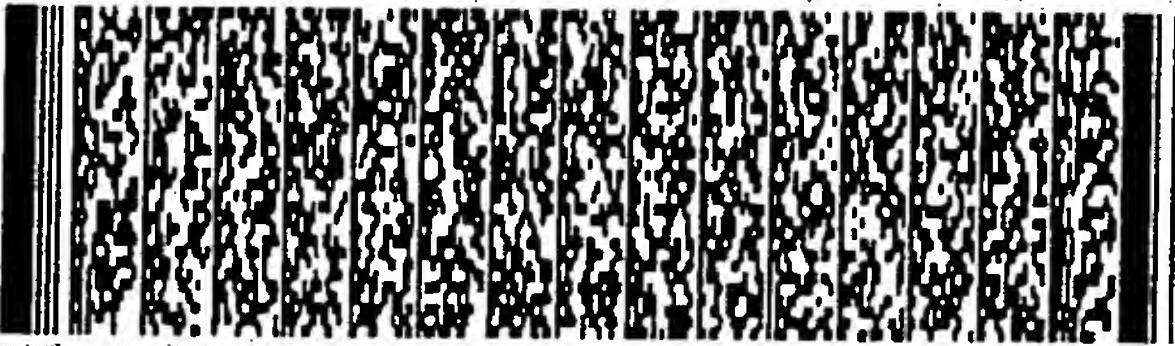
第 11/19 頁



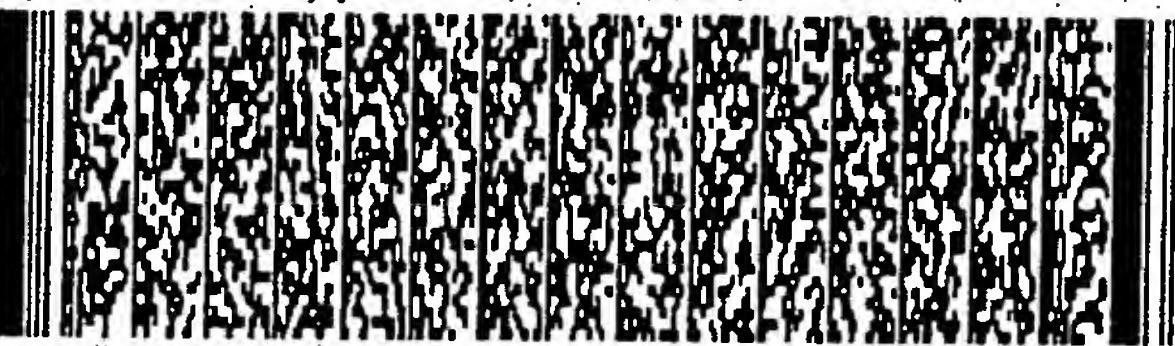
第 11/19 頁



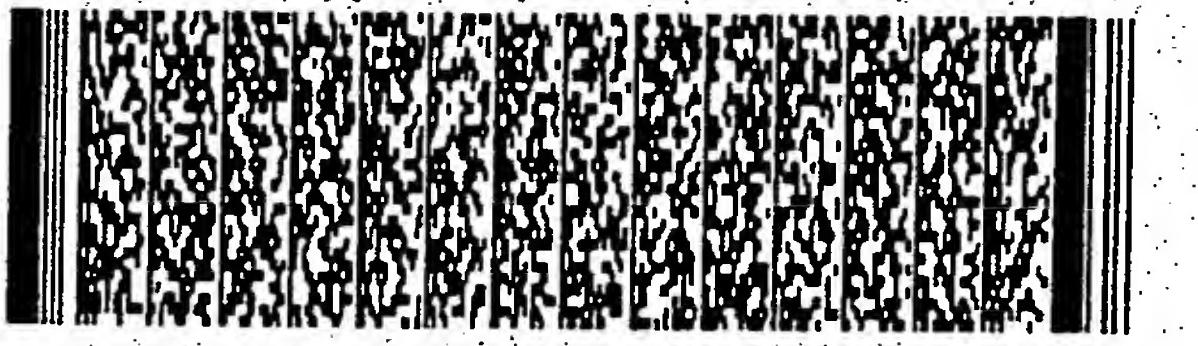
第 12/19 頁



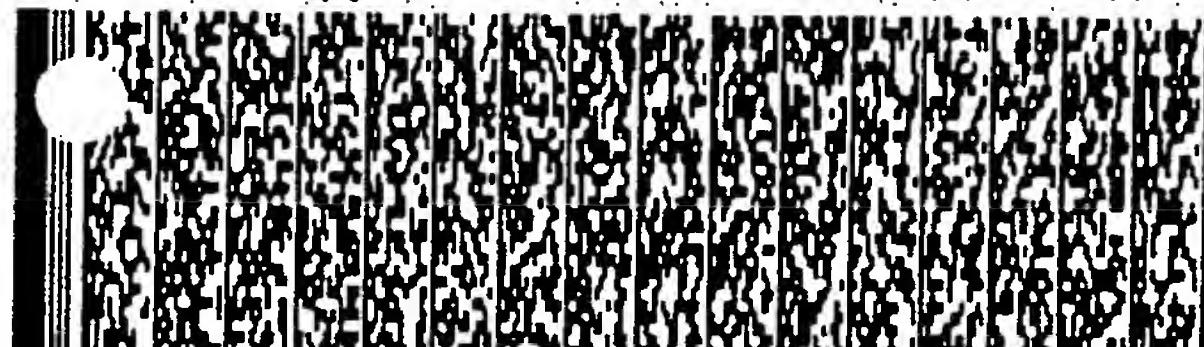
第 13/19 頁



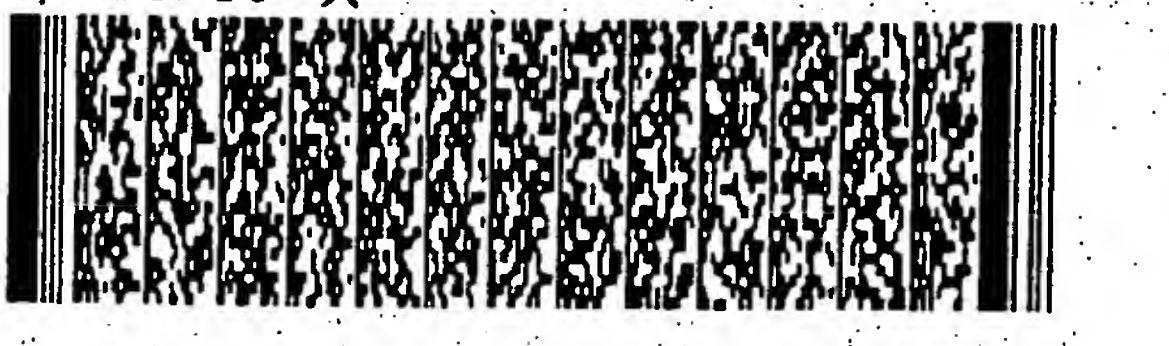
第 15/19 頁



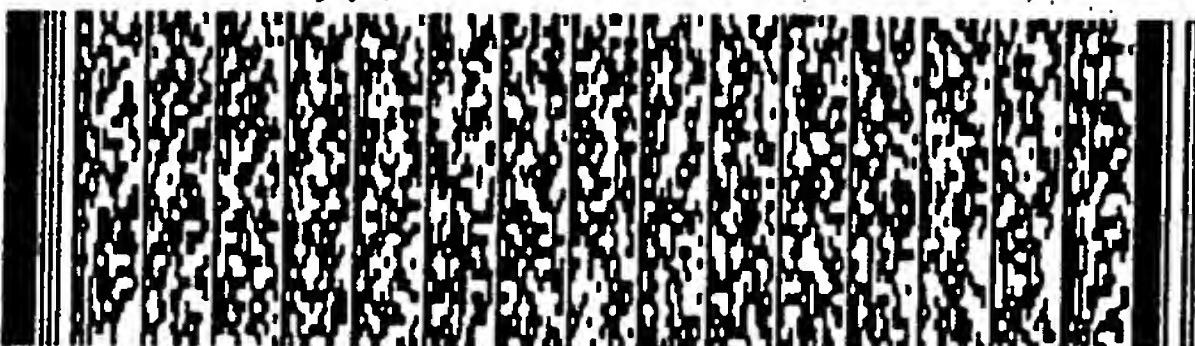
第 17/19 頁



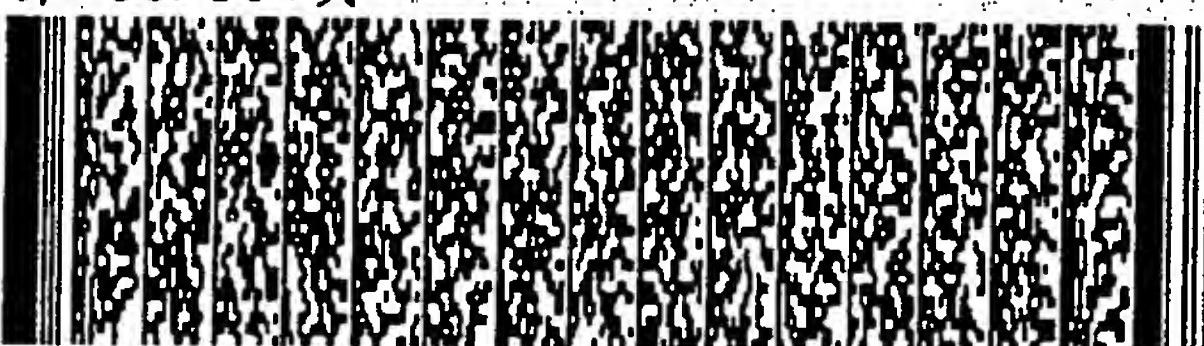
第 19/19 頁



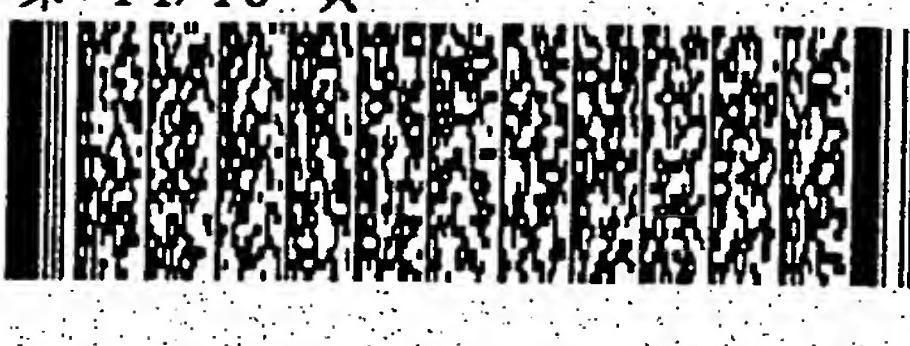
第 12/19 頁



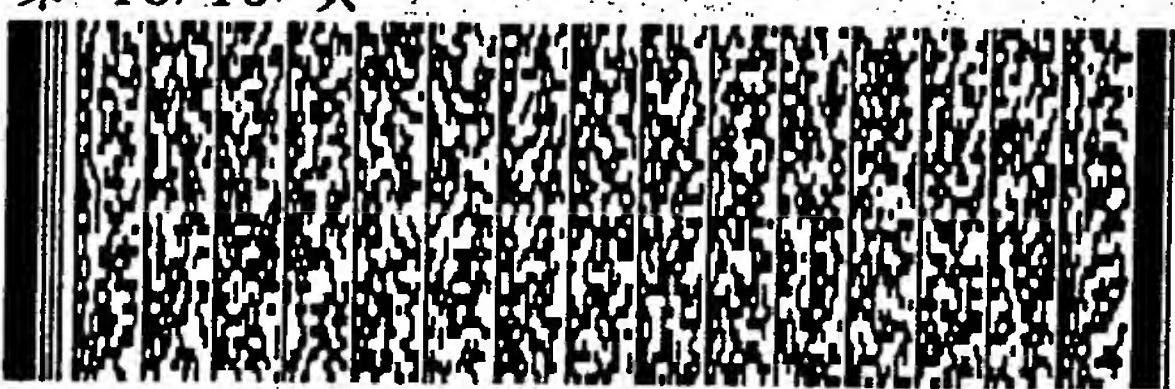
第 13/19 頁



第 14/19 頁



第 16/19 頁



第 18/19 頁

